

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEUREVERBAND DER
ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIKOptische Messtechnik an Mikrotopografien
Kalibrieren von konfokalen Mikroskopen und
Tiefeneinstellnormalen für die RauheitsmessungOptical measurement of microtopography
Calibration of confocal microscopes and depth
setting standards for roughness measurement

VDI/VDE 2655

Blatt 1.2 / Part 1.2

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note	2
Einleitung	2	Introduction	2
1 Anwendungsbereich	3	1 Scope	3
2 Begriffe	5	2 Terms and definitions	5
3 Formelzeichen und Indizes	6	3 Symbols and subscripts	6
4 Eigenschaften der Konfokalmikroskope	7	4 Properties of confocal microscopes	7
4.1 Bestandteile der Geräte und Funktionsprinzip	7	4.1 Instrument components and functional principle	7
4.2 Prinzipien konfokaler Strahlengänge	9	4.2 Principles of confocal beam paths	9
4.3 Z-Scansystem	12	4.3 Z-scan system	12
4.4 Methoden der Topografieberechnung	12	4.4 Methods for topography evaluation	12
5 Kalibrierung und Spezifizierung	16	5 Calibration and specification	16
5.1 Übersicht über Prüfkörper und Messverfahren	16	5.1 Overview of calibration standards and methods of measurement	16
5.2 Kalibrierung der horizontalen Achsen	18	5.2 Calibration of the horizontal axes	18
5.3 Kalibrierung der vertikalen Achse	18	5.3 Calibration of the vertical axis	18
5.4 Kalibrierung der Ebenheit durch Festlegung einer Referenzebene	20	5.4 Calibration of flatness by definition of a reference plane	20
5.5 Bestimmung des Geräteraushens	21	5.5 Determination of the instrument noise	21
5.6 Bestimmung der maximalen Winkelakzeptanz	21	5.6 Determination of the maximum angular acceptance	21
5.7 Bestimmung der kurzen Grenzwellenlänge	22	5.7 Determination of the short cut-off wavelength	22
5.8 Wiederholpräzision der vertikalen Achse	23	5.8 Repeatability of the vertical axis	23
5.9 Nicht berücksichtigte Eigenschaften	24	5.9 Properties not accounted for	24

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

Fachbereich Fertigungsmesstechnik

VDI/VDE-Handbuch Fertigungsmesstechnik
VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik
VDI/VDE-Handbuch Optische Technologien

VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren, Band 3: Betriebsmittel

	Seite		Page
6 Ergebnisbericht der Gerätekalibrierung	24	6 Report of results of the instrument calibration	24
6.1 Allgemeine Informationen	24	6.1 General information	24
6.2 Rückführung horizontaler Achsen	24	6.2 Traceability of lateral axes	24
6.3 Rückführung der vertikalen Achse	25	6.3 Traceability of the vertical axis	25
6.4 Bestimmung von Geräteeigenschaften	25	6.4 Determination of instrument properties	25
7 Messunsicherheit	25	7 Measurement uncertainty	25
7.1 Struktur des Modells	26	7.1 Structure of the model	26
7.2 Aufstellung des Modells	28	7.2 Setting-up of the model	28
7.3 Unsicherheit der Berechnung der Topografiepunkte	30	7.3 Uncertainty in the calculation of the topography points	30
7.4 Unsicherheit der Rillentiefe D	33	7.4 Uncertainty of the groove depth D	33
Schrifttum	36	Bibliography	36